



#	Codice interno	Strumento	Fabbricante	Classificazione	Posizione	Scale tarate	Prima registrazione	Frequenza taratura
Durometri								
1	0010D001	Durometro Dia 2 RC + lettura digitale	Wolpert	Primario	LCQ	HRC, HV1, HV5, HV10, HV30, HB2.5/187.5, HRA	20/01/2003	Annuale
2	0414D001	Durometro KB	KB Pruftechnik	Primario	LCQ	HB2.5/62.5, HB2.5/187.5, HV, HV5, HV10, HRA, HRB, HRC, HR15N, HR30N, HR45N	08/04/2014	Annuale
3	9910D002	Microdurometro Tipo FM-7	Future-Tech	Primario	LCQ	HV0.2, HV03, HV0.5, HV1, HV005, HV2	20/01/2003	Annuale
4	1206MA001	Microdurometro Automatico KB10BVZ-FA	KB Pruftechnik	Primario	LCQ	HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV3, HV5,	07/06/2012	Annuale
5	1409M001	Microscopio ottico ECLIPSE LV150NL	Nikon	Primario	LCQ	Oculari graduati 5x, 10x, 20x, 50x, 100x	11/09/2014	Annuale
6	9910D003	Durometro Brivo-Uvn	Reicherter	Secondario	PCQO	HRC	20/01/2003	Biennale
7	0110D001	Durometro Briro-E	Reicherter	Secondario	LCQ	Prove profondità HR187.5-HR 1000, Briro-e	20/01/2003	Biennale
8	0010D002	Durometro Briviskop 3000 H	Reicherter	Secondario	PCQO	HB5/750, HB10/3000	20/01/2003	Biennale
9	0312D001	Durometro Officine Galileo D200	Officine Galileo	Secondario	PCQO	HRC, HRA, HR15N, HR30N	22/09/2003	Biennale
10	0311P001	Durometro Portatile Metaltester	Affri	Secondario	LCQ	HRC, HRB	25/11/2005	Biennale
11	1704P002	Durometro Portatile EQUOTIP	Proceq	Secondario	LCQ	HRC, HV1-HV5	04/04/2017	Biennale
12	2804DT001	Datalogger + PTM1-220-N-TE da -100°C a +1300°C	PhoenixTM	Secondario	LCQ	TUS e SAT test secondo AMS 2750E Tc tipo N	28/04/2017	Biennale
13	2804DT002	Datalogger + PTM1-010-S-TE da 0°C a +1760°C)	PhoenixTM	Secondario	LCQ	TUS e SAT test secondo AMS 2750E Tc tipo S	28/04/2017	Biennale

LCQ=Laboratorio Controllo Qualità, PCQO=Postazione Controllo Qualità Officina

Rev. 07/2018